PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-322551

(43) Date of publication of application: 12.11.1992

(51)Int.CI.

H04N 1/028 HO4N 5/335

BEST AVAILABLE COPY

(21)Application number: 03-116686

(71)Applicant: NIKON CORP

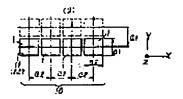
(22)Date of filing:

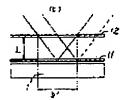
22.04.1991

(72)Inventor: SHIBUYA MASATO

(54) IMAGE SENSOR AND OPTICAL DEVICE USING THE SAME

PURPOSE: To educe aliasing being a cause to noise by a frequency component in excess of a sampling frequency without use of a complicated optical device such as an optical low pass filter. CONSTITUTION: Plural picture elements 1 are arranged regularly in a line at a pitch of a2 and an opening to limit a luminous flux radiating to the picture element is provided. The opening consists of an opening 11 at a light receiving side on the picture element and an incident opening 12 arranged at a prescribed interval along the optical incident direction.







LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本國特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-322551

(43)公開日 平成4年(1992)11月12日

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 4 N 1/028

5/335

Z 9070-5C

V 8838-5C

審査請求 未請求 請求項の数4(全 7 頁)

(21)出願番号

特顯平3-116686

(22)出顧日

平成3年(1991)4月22日

(71)出願人 000004112

株式会社ニコン

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

(72) 発明者 渋谷 真人

東京都品川区四大井一丁目6番3号 株式

会社ニコン大井製作所内

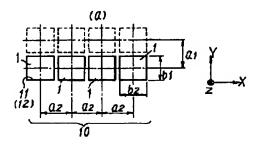
(74)代理人 弁理士 山川 政樹

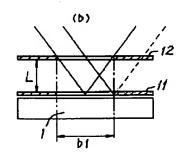
(54) 【発明の名称】 イメージセンサおよびこれを用いた光学装置

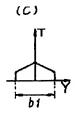
(57)【要約】

【目的】 光学的ローパスフィルタ等複雑な光学装置を 用いることなく、標本化周波数を超える周波数成分でノ イズの原因となるエイリアシスを低減する。

【構成】 複数の画素1を規則的に一列にa2のピッチ で配列し、この画案に入射される光束を制限する開口を 設ける。この関口は、画素上の受光側の閉口11とこれ より光入射方向に沿って所定間隔をおいて配置された入 射側の閉口12とからなる。







【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の画素を規則的に配列してなるイメ ージセンサにおいて、光学系を経て各画案に入射される 光束を制限する阴口を、光の入射方向に沿って所定間隔 をおいて少なくとも2つ設けたことを特徴とするイメー ジセンサ。

1

画素が1次元に配列された1次元イメージセンサであっ て、前配各画素の配列方向と垂直な方向における走査ビ ッチ間隔をa1、この垂直方向の開口の長さをb1、2つ 10 の開口の間隔をし、前配光学系の開口数をNA、2つの 開口間の媒質の平均屈折率をnとするとき、

b1/2 < 2NAL/n

かつ

1. 6a1 < b1 < 3. 0a1

を満足するイメージセンサを有する光学装置。

【請求項3】 請求項1において、イメージセンサは配 列ピッチm(正の整数) a2で配列された複数画素から なる第1画素列と、配列ピッチma2で配列された複数 画素からなり前記第1画案列と画案配列方向にa2の整 20 -数倍 (1~m-1) だけずれて並列配置されたm-1個 の画案列とからなるスタガ配列1次元イメージセンサで あって、画案配列方向の前配開口の長さをb2、2つの 開口の間隔をL、前記光学系の開口数をNA、2つの開 口間の平均屈折率をnとするとき、

b2/2 < 2 NAL/n

かつ

1. 6a2 < b2 < 3. 0a2

を満足するイメージセンサを有する光学装置。

【簡求項4】 簡求項1において、イメージセンサは配 30 列ピッチm(正の整数) a2で配列された複数画素から なる第1画素列と、配列ピッチma2で配列された複数 画素からなり前配第1画素列と画素配列方向にa2の整 数倍 $(1 \sim m-1)$ だけずれて並列配置されたm-1 個 の画素列とからなるスタガ配列1次元イメージセンサで あって、前記各画素の配列方向と垂直な方向における走 査ピッチを a 1、画素配列方向と垂直な方向の前配開口 の長さを b1、 画素配列方向の前配開口の長さを b2、 2 つの開口の間隔をL、前記光学系の開口数をNA、2つ の開口間の平均屈折率をnとするとき、

b1/2 < 2NAL/n

かつ

b2/2 < 2 NAL/n

かつ

1. 6a1 < b1 < 3. 0a1

かつ

1. 6a2 < b2 < 3. 0a2

b1/2 <2 NAL/n かつ

を満足するイメージセンサを有する光学装置である。

【0007】また、配列ピッチm (正の整数) a2で配 50 a2で配列された複数画素からなり第1画素列と画素配

*かつ

m≥ 2

を満足するイメージセンサを有する光学装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、撮像する画像情報に おけるエイリアシスを改善するようにしたイメージセン サおよびそのイメージセンサを用いた光学装置に関す

[0002]

【従来の技術】一般に知られているように、CCDを用 いた固体撮像素子などの画素配列型イメージセンサ(以 下単にイメージセンサという)によって被写体の画像情 報を離散的に採取する場合、イメージセンサは、被写体 の空間周波数成分の内、イメージセンサ自身の標本化周 波数(ナイキスト周波数)を超える周波数成分は採取で きない。この標本化間波数を超える周波数成分はエイリ アシス(折り返しひずみ)と呼ばれるノイズとなり、こ のノイズはイメージセンサが採取した画像情報に対して モワレ縞や偽色を発生させて悪影響を与える。

【0003】このような悪影響を防止するためには、イ メージセンサの前に位置する光学系のカットオフ周波数 をイメージセンサの標本化周波数よりも下げることによ って、イメージセンサにイメージセンサの標本化周波数 を超える周波数成分が入らないようにしてやればよい。 このため、従来は光学的ローパスフィルタをイメージセ ンサの直前や光学系の瞳位置に設置するなどの方法がと られている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上述した従来の撮影装 置においては、光学的ローパスフィルタを設置するた め、光学系が複雑になるとともに、この光学的フィルタ の位置の関整を行う必要があるという欠点があった。こ の発明は、このような課題に鑑みてなされたもので、光 学系を複雑にすることなくエイリアシスを低減すること のできるイメージセンサおよびこれを用いた光学装置を 提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】この発明のイメージセン 40 サは、複数の画素を規則的に配列し、光学系を経て各画 素に入射される光東を制限する開口を、光の入射方向に 沿って所定間隔をおいて少なくとも2つ設けたものであ る。

【0006】また、各画素の各画素の配列方向と垂直な 方向における走査ビッチ間隔をal、この垂直方向の開 口の長さを b1、2つの 開口の 間隔をし、光学系の 開口 数をNA、2つの開口間の平均屈折率をnとするとき、

1. 6a1 < b1 < 3. 0a1

列された複数画素からなる第1画素列と、配列ピッチm

3

列方向に a 2の整数倍(1~m-1)だけずれて並列配 置されたm-1個の画案列とからなるスタガ配列1次元 イメージセンサであり、面素配列方向の前配開口の長さ*

b2/2 <2 NAL/n かつ

を満足するイメージセンサを有する光学装置である。 【0008】また、さらに上記に加え、各画素の配列方※

を満足するイメージセンサを有する光学装置である。 [0 0 0 91

る開口を少なくとも2つ設けることにより、イメージセ ンサを構成する画素上の感度分布を制御し、このイメー ジセンサにおける伝達関数MTF(v) の特性を変化させる ことができる。したがって、イメージセンサのナイキス ト周波数を超える空間周波数帯域での伝達関数MTF(v) の値を抑制することが可能となり、光学的ローパスフィ ルタ等を用いることなくイメージセンサで撮像した画像 **情報のエイリアシスを低減し、鮮明な画像を得ることが** できる。

[0010]

【実施例】次に、この発明について図面を参照して説明 する。図1(a)はこの発明の一実施例を示す1次元配列 のイメージセンサ(リニアアレイセンサ)の平面図であ る。所定の配列ピッチa2 で配列された画案1によって イメージセンサ10が構成されている。画索の配列方向 Xに対して垂直な走査方向Yにこのイメージセンサ10 を破線で示すように走査ビッチa1 で像に対して相対的★

 $MTF(\nu) = (2/3) \{ \sin(2\pi\nu a1)/(2\pi\nu a1) \}$

+ $(1/3) \{\sin(\pi \nu a 1)/(\pi \nu a 1)\}^2$ • • • • (1)

ナイキスト周波数は、 vN = 1 / (2 a 1) であり、 (1)式で示されるMTF特性を図2に示す。図2におい て、横軸は空間周波数 (v)、縦軸は伝達関数 (MTP) である。ところで、従来のイメージセンサでは受光側の☆ $MTF(\nu) = \sin(\pi \nu a 1) / (\pi \nu a 1)$

この(2)式で示される従来のMTF特性を参考に図3に 示す。

【0013】この図3において示されるように、従来の イメージセンサでは、ナイキスト周波数ッN よりも高い 空間周波数においても伝達関数NTF(v)の値は大きいの で、ナイキスト周波数 v N を超える空間周波数成分がエ 40 イリアシスとなる。図2に示した本発明の例では、ナイ キスト周波数 v N より高い空間周波数の伝達関数MTF◆

 $MTF(\nu) = \sin(2\pi\nu a 1) / (2\pi\nu a 1)$

【0014】この(3)式で示される従来のMTF特性は 図3に示したようになる。この場合は、vN におけるNT Pは零になっており、vNより少し高い周波数によるエイ リアシスは小さいが、(3/2) vN 付近でのMTFは絶 対値が大きくなり、エイリアシスの影響が現れてくる。 本発明においては、各国素上の実質的感度の分布特性を 変えることによって、ナイキスト周波数 v N を超える空 50

*をb2、2つの関口の間隔をL、光学系の関口数をNA、 2つの開口間の平均屈折率をnとするとき、

4

1. 6a2 < b2 < 3. 0a2

※向と垂直な方向における走査ピッチを a 1、画案配列方 向と垂直な方向の関ロの長さをb1とするとき、

b1/2 <2 NAL/n かつ 1.6 a1 <b1 <3.0 a1 かつ m≥2

★に走査することにより、X方向の配列ピッチa2 および Y方向の配列ピッチa1 で画素1が配列されて構成され 【作用】本発明においては、上配のように光束を制限す 10 た2次元配列のイメージセンサで摄像した場合に相当す る画像情報を摄像することができる。

> 【0011】図1(b)は本発明によるイメージセンサの 横断面図を示したものであり、光学系(図示せず)を経 て入射した光の光束を制限するために、2つの関口が設 置されている。この開口は、光電変換素子からなる画素 1の上に設けられた受光側の開口11とこの閉口11と 所定間隔しだけ離れて設けられた同形状の光入射側の開 ロ12とから構成される。この関ロ11、12の画素配 列方向 (X方向) の長さはb2であり、画案配列と垂直 **20** の方向 (Y方向) の長さはb1である。ここで、b1=2 a1のとき、受光側の関ロ11の中央に入る光学系の光 束の広がりが、入射側の開口12の大きさで一致すると すれば、画素の実効的な感度Tの分布は、図1(c)に示 されたようになる。

【0012】このとき、イメージセンサの画来のもつ伝 達関数MTF(ν)は、次式のようになる。

30☆開口のみしかなく、かつ光電変換部分では光束は基本的 には制限されていなかった。また、一般には、b1=a1 である。このような従来のもののMTFは次式のようにな

 \cdots (2)

◆(ν)の値が低くなっており、エイリアシスの発生が少な くなっている。 単にMTF 特性を変えるのであれば、従 来のイメージセンサのように開口が1つであっても、画 素1の走査ピッチa1および走査方向Yの長さb1の比率 を変化させることによっても可能であり、ナイキスト周 波数 v N を超える空間周波数成分の伝達関数MTF(v) の 値を低減させてエイリアシスを改善することもできる。 ここで、b1=2a1のときのMTPは次式のようになる。

 \cdots (3)

間周波数帯域の伝達関数MTP(v)の値を低減させて、エ イリアシスを改善することを可能としたものである。本 発明によれば、従来のイメージセンサにおける単に走査 ピッチと画素サイズとの比を変えることによるMTF特性 の変化による効果に比して、より優れたエイリアシス低 減の効果を得ることができる.

【0015】図1の実施例では、受光側の開口11の中

央に集光する光束が入射側の関口12によって制限され るようにしたが、光学系に入射した光の光束を有効に使 用するためには、受光傾の開口11の中央に集光する光 束は、いわゆるケラレが少ないほうがよい。しかし、ケキ

5

ここで、NA は光学系の関ロ数、nは2つの閉口11と 12の間の平均屈折率である。(4)式の等号が成立す るときの感度分布を図5に示す。また、開口の長さb1 が長すぎると、ナイキスト周波数 vN より低い空間周波 数帯域のMTFの値が下がってしまい、本来要求される画※10 い。

1. 6 a1<b1<2. 6 a1

【0016】以下の表に、b1およびLの値が(4)、

(5) を満足する場合に実施例によってその有効性を示★

★ラレを少なくするために入射側の開口12と受光側の開 ロ11があまり接近してしまうと、感度の非一様性の効 果が無くなってしまうので好ましくない。少なくとも、 次式を満足することが望ましい。

6

$$\cdots (4)$$

※像信号までが消失してしまうことになる。逆にb1が短 すぎると、ナイキスト周波数 v N より高い空間周波数帯 域のMTFの値が大きくなって、エイリアシスが発生して しまう。そのため、b1は次式を満足することが望まし

 \cdots (5)

		図番号	b 1	L
	従来例	図 3	al	0
	比較例	⊠ 4	2 al	0
١	第1 実施例	⊠ 2	2 a 1	(n b1)/(2 NA)
	第2 実施例	⊠ 6	2 a1	(n b1)/(4 NA)
١	第3実施例	⊠ 7	2.6 al	(n b1)/(2 NA)
	第4 実施例	⊠ 8	2.6 al	(n b1)/(4 NA)
	第5 実施例	⊠ 9	1.6a1	(n b1)/(2 NA)
	第6实施例	⊠10	1.6 a1	(n b1)/(4 NA)
		1	1	

各パラメータをこの表に示し、MTF特性をそれぞれ各図 に示す。第1~第6実施例により、(4)、(5)式の 条件がエイリアシスを低減させ、かつ結像性能に有効な ナイキスト周波数内のMTF値をあまり低下させない条件 であることがわかる。なお、Lは第1、第3、第5の実 30 れた第1画素列と、同じく画素2が配列ピッチ2a2 で 施例の長さがケラレの発生しない限度であった。

【0017】さて、図1(a) に示したような1次元のイ メージセンサ10では、画素1同志が密接して配列され ているため、画索1の配列方向Xの長さを変えることは できないが、画素1の配列方向Xと垂直な走査方向Yの 長さを変えることはできる。これに対して、図11(a) に示したスタガ配列1次元イメージセンサ20では、配 列方向Xおよび走査方向Yのいづれの方向に対しても各☆

 $MTF(\nu) = (2/3) \{ \sin(2\pi \nu a 2) / (2\pi \nu a 2) \}$

+
$$(1/3) \{\sin(\pi \nu a 2)/(\pi \nu a 2)\}^2 \cdots (6)$$

なる。

また、画素配列方向Xのナイキスト周波数 vN は、vN = 1 / (2 a 2) であり、この場合も画素配列方向と垂◆

b2/2 < (2 NAL) / n

1. 6 a2<b2<2. 6 a2

スタガ配列の場合には、XYの両方向でエイリアシスを 改善することが可能であり、このためには(4)、 (5)、(7)、(8)式を全て満足する必要がある。 スタガ配列の場合にもa1は走査ピッチを示すが、これ は必ずしも2つの画素列の間隔に等しいとは限らない。

◆直な方向でのMTF特性の改善と同様な考えが成立して、

☆画素2の長さを変更することができる。21は長方形の

閉口である。 すなわち、図11(a) に示すように、スタ

ガ配列1次元イメージセンサ20は、画索2が配列ピッ

チ2 a2 (ma2における正の整数mが2の例) で配列さ

配列され第1画素列と画素配列方向にa2 だけずれて並

列配置された第2画素列とから構成されている。 b2は 閉口の画案配列方向Xの長さである。また、図11(b)

は横断面図、図11(b)は画素配列方向Xの感度分布図

【0018】このとき、b2=2a2とすると、各画素2

上の開口による画素配列方向XのMTFは、次式のように

... (8)

開口の形状に自由度が増える。3列以上であると、非常 に有効である。図12に示す実施例は3列の例であり、 スタガ配列1次元イメージセンサ30は、画索3が配列 ピッチ3 a2 (ma2における正の整数mが3の例)で配 $\{0\ 0\ 1\ 9\}$ スタガ配列では、列の数が多ければさらに $50\ 2$ で配列され第1 国案列と国案配列方向にa2だけずれ

次式を満足することが望ましい。 \cdots (7) 7

て並列配置された第2国条列と、同じく国条3が配列ピッチ3 a2 で配列され第1国条列と国条配列方向に2 a 2 だけずれて並列配置された第3 国条列とから構成されている。なお、31は長方形の関口である。

【0020】以上の実施例では入射側の関口と受光側の関口を同じ形状にしたが、異なる形状にすることもできる。また、入射側の関口と受光側の関口を一体になるような筒状の光吸収体で形成することもできる。また、3つ以上の関口を設けても同様の効果が得られる。さらに、実施例では、両関口の位置は結像面内方向で一致し 10ているが、実際の光学系では周辺での主光源に傾きがあるため、その傾きに合わせてずらせることが考えられる。

【0021】図13は、受光側の開口11を画案となるホトダイオード等の光電変換素子15に遮光膜のように一体に形成した例を示す。この場合は、光束を制限するための開口は1つ作るだけでよいので、製造が容易となる。また、ホトダイオード等の光電変換案子の大きさそのものを開口として作用させることもできる。以上の実施例では、イメージセンサの2つの開口のどちらに像が形成されても光子結像性能は基本的には変わらないので、実質的に焦点深度が深くなるという利点がある。

[0022]

【発明の効果】以上説明したように、この発明に使用するイメージセンサは、イメージセンサを構成する各国案に入射する光東を、光入射方向に沿って間隔を持つ少なくとも2つの開口で制限することにより、実効的な国素の感度分布を非一様にでき、MTF特性を修正してエイリアシスを低減することができる。この結果、光学的ローパスフィルタを使用せずにエイリアシスを低減できるため、従来に比較して光学系の構成が簡素化され、光学系の調整は不要になるという効果がある。また、この発明のイメージセンサは、ファクシミリや複写機用にも使用可能であることは言うまでもない。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a)は本発明の一実施例を示す1次元配列イメージセンサの平面図、(b)はその1つの国業の横断面図、(c)は國素上の感度分布図である。

8

【図2】本発明の一実施例の伝達與数特性図である。

【図3】従来の1つの例の伝達関数特性図である。

【図4】従来の他の例の伝達関数特性図である。

【図 5】 本発明の一
東施例の画素上の感度分布図である。

【図6】本発明の他の実施例の伝達関数特性図である。

【図7】本発明の他の実施例の伝達関数特性図である。

【図8】本発明の他の実施例の伝達関数特性図である。

【図9】本発明の他の実施例の伝達関数特性図である。

【図10】本発明の他の実施例の伝達関数特性図であ る。

【図11】(a)は本発明のスタガ配列の実施例の1次元配列イメージセンサの平面図、(b)はその1つの画案の横断面図、(c)は画案上の感度分布図である。

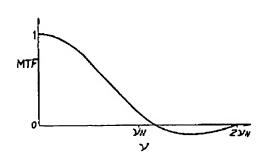
【図12】本発明のスタガ配列の他の実施例の1次元配列イメージセンサの平面図である。

20 【図13】本発明の光電変換素子に受光側の開口が形成された実施例の断面図である。

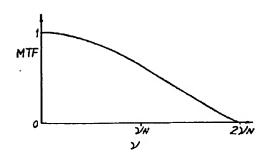
【符号の説明】

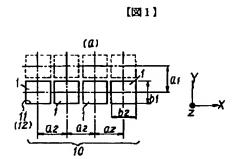
1,2,3	画案
10	1 次元配列イメージセンサ
1 1	受光側の関ロ
1 2	入射側の閉口
20,30	スタガ配列 1 次元配列イメージセンサ
a1	画案配列方向と垂直方向の走査ビッチ
b 1	画素配列方向と垂直方向の関口の長さ
a 2	画素の配列ピッチ(配列間隔)
b2	画素配列方向の開口の長さ
L	閉口の間隔
x	画素配列方向
Y	画索配列方向と垂直な走査方向

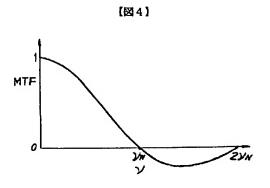
[図2]

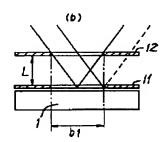


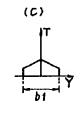
[図3]

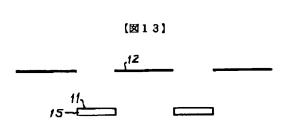


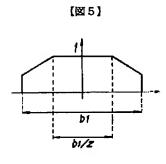


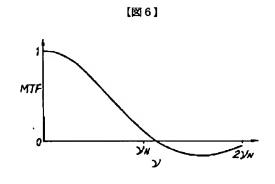


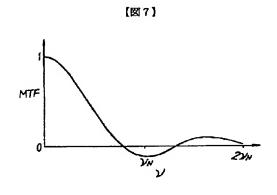


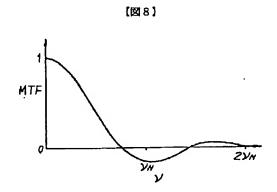


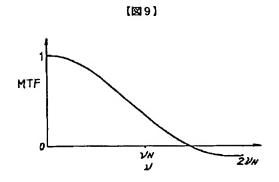


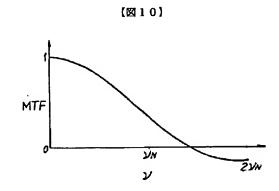




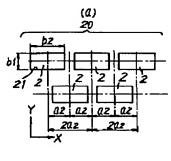


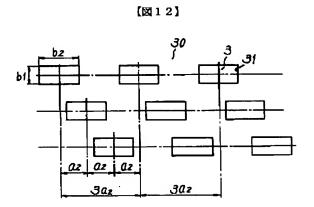


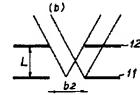


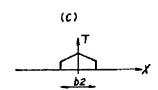


[図11]









)

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第3区分 【発行日】平成11年(1999)4月30日

【公開番号】特開平4-322551 【公開日】平成4年(1992)11月12日 【年通号数】公開特許公報4-3226 【出願番号】特願平3-116686 【国際特許分類第6版】

HO4N 1/028

5/335

(FI)

HO4N 1/028 Z 5/335 V

【手続補正書】

【提出日】平成9年11月14日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】変更

【補正内容】

【0014】との(3)式で示される従来のMTF特性は図4に示したようになる。との場合は、レNにおけるMTFは零になっており、レNより少し高い周波数によるエイリアシスは小さいが、(3/2)レN付近でのMTFは絶対値が大きくなり、エイリアシスの影響が現れてくる。本発明においては、各画素上の実質的感度の分布特性を変えることによって、ナイキスト周波数レNを超える空間周波数帯域の伝達関数MTF(レ)の値を低減させて、エイリアシスを改善することを可能としたものである。本発明によれば、従来のイメージセンサにおける単に走査ビッチと画素サイズとの比を変えることに

よるMTF特性の変化による効果に比して、より優れたエイリアシス低減の効果を得ることができる。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0020

【補正方法】変更

【補正内容】

【0020】以上の実施例では入射側の開口と受光側の開口を同じ形状にしたが、異なる形状にすることもできる。また、入射側の開口と受光側の開口を一体になるような筒状の光吸収体で形成することもできる。また、3つ以上の開口を設けても同様の効果が得られる。さらに、実施例では、両開口の位置は結像面内方向で一致しているが、実際の光学系では周辺での主光線に傾きがあるため、その傾きに合わせてずらせることが考えられる。

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.